

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 1
AMENDEMENT 1

Solderless connections –
Part 2: Crimped connections – General requirements, test methods and practical guidance

Connexions sans soudu –
Partie 2: Connexions serties – Exigences générales, méthodes d'essai et guide pratique

STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60352-2:2006/AMD1:2013
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cbe8b196-df97-45fe-b011-11d1b3000000000000/iec-60352-2-2006-amd1-2013>





THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.
If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Liens utiles:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 60352-2

Edition 2.0 2013-06

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 1
AMENDEMENT 1

Solderless connections –
Part 2: Crimped connections – General requirements, test methods and
practical guidance

Connexions sans soudure –
Partie 2: Connexions serties – Exigences générales, méthodes d'essai et guide
pratique

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

D

ICS 31.220.10

ISBN 978-2-8322-0863-2

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48B/2340/FDIS	48B/2348/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

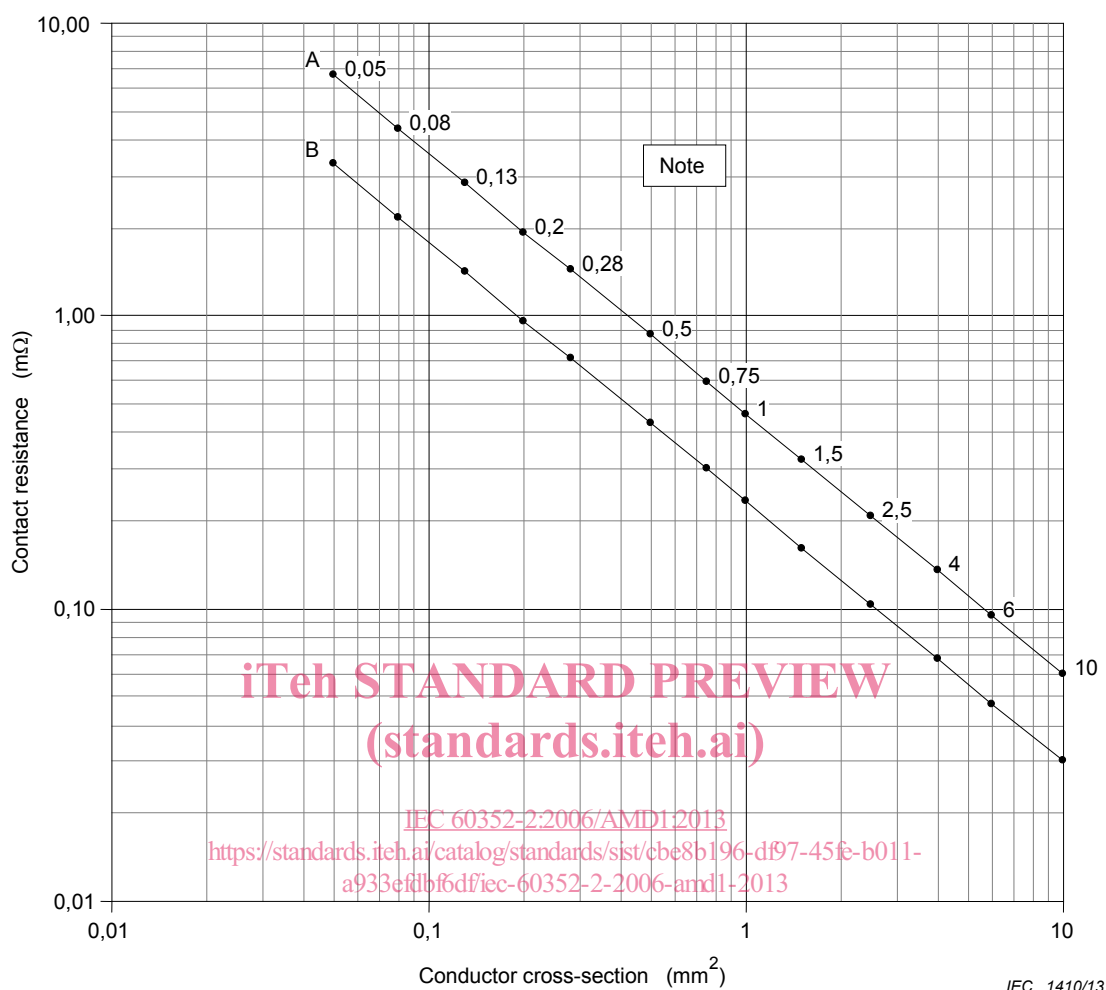
- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

ITEH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60352-2:2006/AMD1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cbe8b196-df97-45fe-b011-a933efdbf6df/iec-60352-2-2006-amd1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cbe8b196-df97-45fe-b011-a933efdbf6df/iec-60352-2-2006-amd1-2013>

Replace existing Figure 6 with the following:



Curve A: Values for initial contact resistance, maximum.

Curve B: Values for maximum change in resistance after electrical or climatic conditioning.

NOTE Numbers indicate specific conductor cross-sections in mm^2 .

The lines for maximum initial contact resistance (A) and maximum change in resistance after electrical or climatic conditioning (B) are based on the following equations. These formulas may be used in place of the graph in Figure 6 to determine the maximum allowed initial resistance and post-conditioning change in resistance values.

$$A = 0,4596xC^{-0,8843}$$

$$B = A / 2$$

Where:

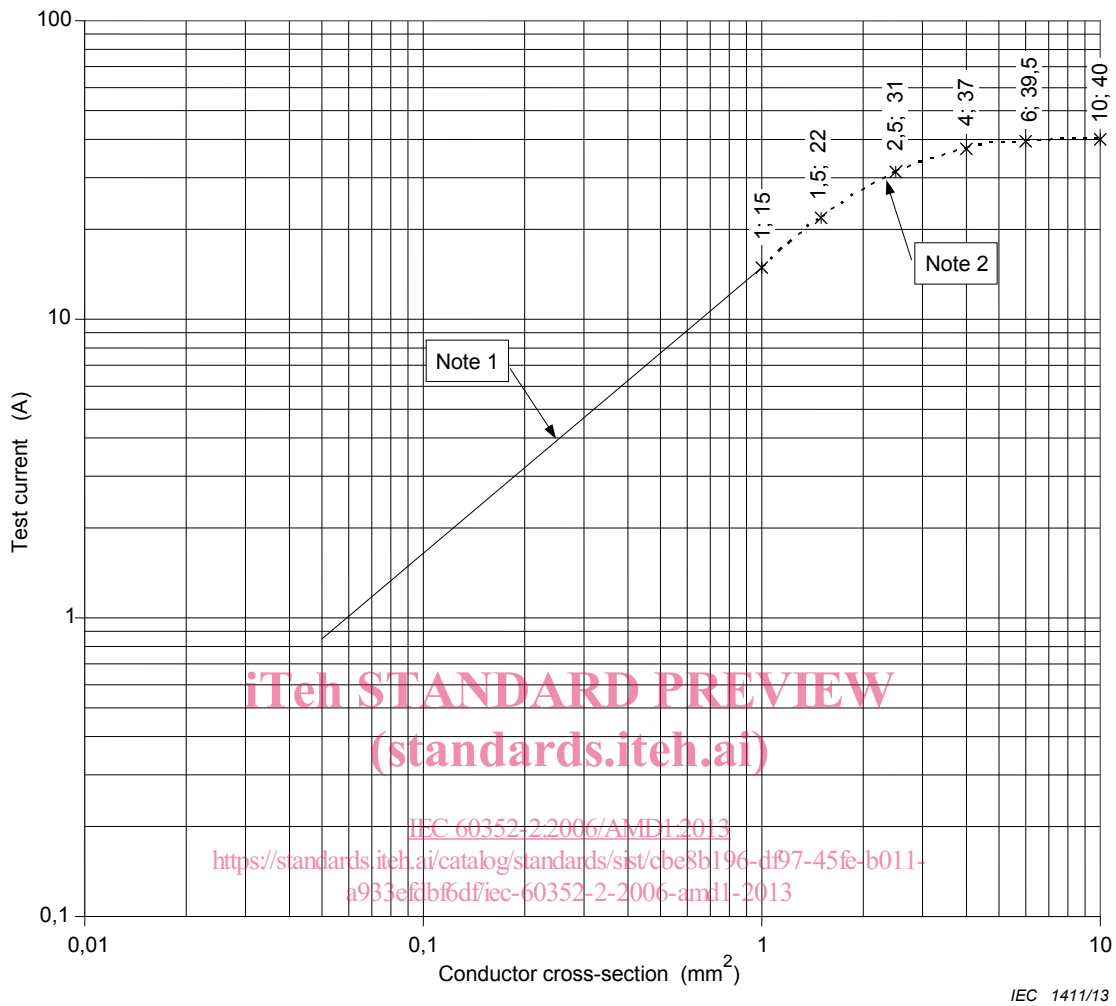
A is the maximum allowed initial resistance, in milliohms ($m\Omega$);

B is the maximum allowed change in resistance, in milliohms ($m\Omega$);

C is the wire cross-section, in mm^2 .

Figure 6 – Contact resistance R_C of crimped connections with copper barrels and copper conductor ($K = 1$)

Replace existing Figure 8 with the following:



NOTE 1 Test current = $15 \times C^{0.958}$ for conductor cross-sections from 0,05 mm² to 1 mm², where C is the wire cross-section in mm²

NOTE 2 Test current references for conductor cross-sections above 1 mm².

Figure 8 – Test current for crimped connections

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60352-2:2006/AMD1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cbe8b196-df97-45fe-b011-a933efdbf6df/iec-60352-2-2006-amd1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cbe8b196-df97-45fe-b011-a933efdbf6df/iec-60352-2-2006-amd1-2013>

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/2340/FDIS	48B/2348/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

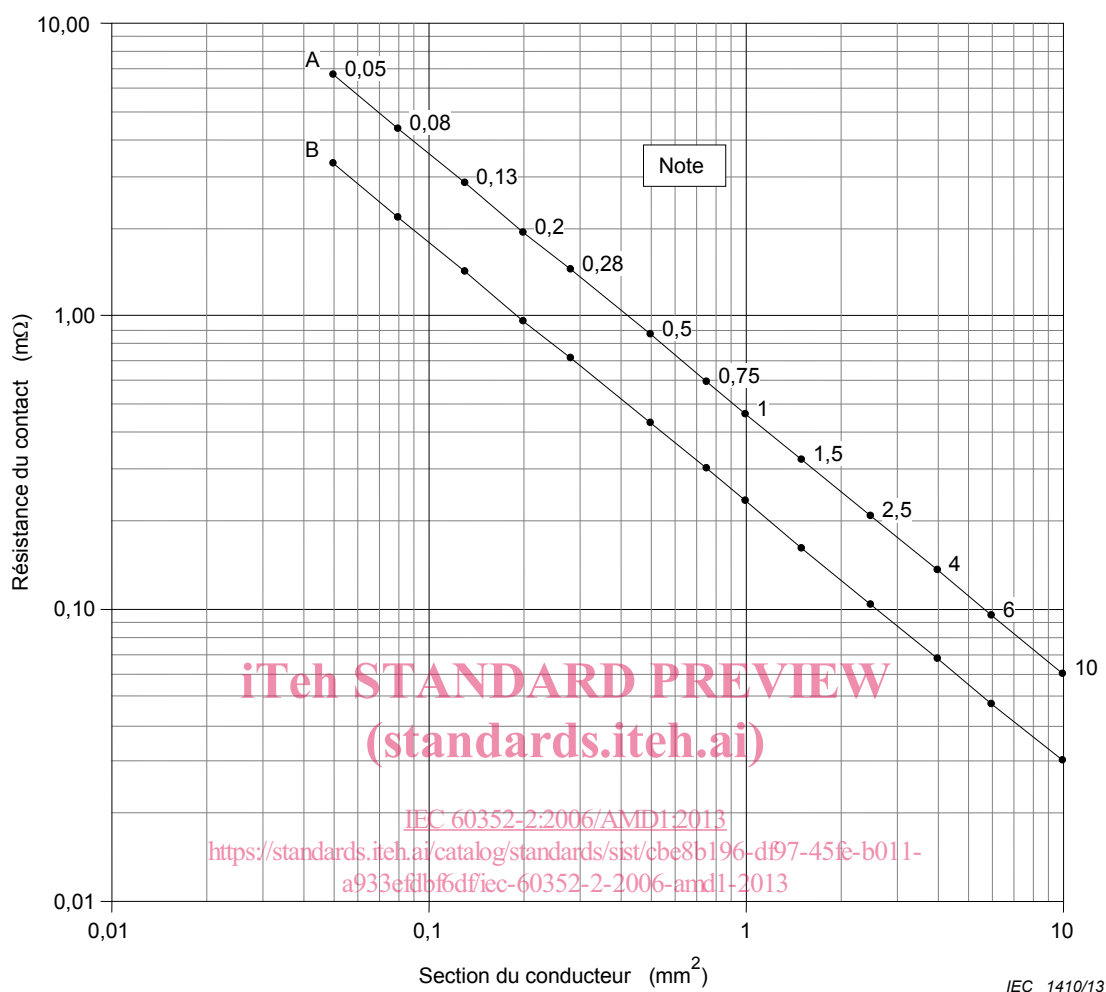
- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

ITEH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60352-2:2006/AMD1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cbe8b196-df97-45fe-b011-a933efdbf6df/iec-60352-2-2006-amd1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cbe8b196-df97-45fe-b011-a933efdbf6df/iec-60352-2-2006-amd1-2013>

Remplacer la Figure 6 existante par la figure suivante:



Courbe A: Valeurs de la résistance de contact initiale, maximum.

Courbe B: Valeurs de la variation maximale de la résistance après conditionnement électrique ou climatique.

NOTE Les chiffres indiquent les sections transversales des conducteurs spécifiques en mm².

Les lignes pour la résistance de contact initiale maximum (A) et le changement maximum dans la résistance après le conditionnement électrique ou climatique (B) sont fondées sur les équations suivantes. Ces formules peuvent être utilisées à la place du graphique dans la Figure 6 pour déterminer la résistance initiale maximale autorisée et le changement de pré-conditionnement dans les valeurs de résistance.

$$A = 0,4596 \times C^{-0,8843}$$

$$B = A / 2$$

Où:

A est la valeur de la résistance initiale maximale autorisée, en milliohms (mΩ);

B est la valeur de la variation maximale autorisée, en milliohms (mΩ);

C est la section du conducteur, en mm².

Figure 6 – Résistance de contact R_C des connexions serties avec fûts en cuivre et conducteur en cuivre ($K = 1$)